目录

- DS18B20数字温度计 (一) 电气特性, 寄生供电模式和远距离接线
- DS18B20数字温度计 (二) 测温, ROM和CRC算法
- DS18B20数字温度计 (三) 1-WIRE总线 ROM搜索算法和实际测试

DS18B20 搜索算法

以下说明当总线上存在多个 DS18B20 芯片时, 识别各个 DS18B20 的编号并进行通信的算法.

其实这是 1-Wire 总线的搜索算法, 当 1-Wire 总线上挂接了多个设备时, 总线控制端需要通过 ROM Search 命令来判断总线上存在的设备以及获取他们的8字节唯一ROM.

1-WIRE SEARCH ALGORITHM 算法规则和实现机制

ROM搜索算法的核心规则,是在搜索中重复进行一个简单的三步操作

步骤1: 读一次: 得到一位的值

总控读取1个bit. 这时每个设备都会将ROM当前这一位的bit值放到总线上, 如果这位是0, 就会对总线写**0**(拉低总线), 如果这位是1, 则会对总线写**1**, 允许总线保持高电平. 如果两者都存在, 总控读取的是**0**(低电平).

步骤2: 再读一次: 得到这位的补码

总控继续读一个bit, 这时候每个设备会将ROM当前这一位的bit的补码放到总线上, 如果这位是0就会写1, 如果这位是1则会写0, 如果两者都存在, 总控会读到一个0, 这样总控就会知道存在多个设备, 并且它们的ROM在这一位上的值不同.

步骤3: 写一次: 指定这一位的目标值

总控写入一个bit, 比如写入0, 表示在后面的搜索中选择这一位为0的设备, 屏蔽掉这一位为1的设备

循环

总线控制端在8字节ROM的每一位上执行这个三步操作后, 就能知道一个 DS18B20 的 8字节 ROM 值, 如果总线上有多个 DS18B20,则需要重复多次.

搜索示例

示例数据

下面的例子假设总线上有4个设备,对应的ROM值分别为

- ROM1 00110101...
- ROM2 10101010...
- ROM3 11110101...
- ROM4 00010001...

示例搜索过程

搜索步骤如下

- 1. 单线总线控制端(以下简称总控)执行 RESET, 所有的 DS18B20设备(以下简称设备)响应这个RESET
- 2. 总控执行 Search ROM 命令
- 3. 总控读取1个bit. 这时每个设备都会将自己的ROM的第一个bit放到总线上, ROM1 和 ROM4 会对总线写0(拉低总线), 而 ROM2 和 ROM3 则会对总线写1, 允许总线保持高电平. 这时候总控读取的是0(低电平).
- 4. 总控继续读下一个bit, 每个设备会将第一个bit的补码放到总线上, 这时候 ROM1 和 ROM4 写1, 而 ROM2 和 ROM3 写0, 因此总控依然读到一个0, 这时候总控会知道存在多个设备, 并且它们的ROM在这一位上的值不同.
- 5. (说明)从每次的两步读取中观察到的值分别有以下的含义
 - 00有多个设备,且在这一位上值不同
 - 01 所有设备的 ROM在这一位上的值是**0**
 - 10 所有设备的 ROM在这一位上的值是1
 - 11 总线上没有设备
- 6. 总控写入一个bit, 比如写入 $\mathbf{0}$, 表示在后面的搜索中屏蔽 ROM2 和 ROM3, 仅留下 ROM1 和 ROM4
- 7. 总控再执行两次读操作,读到的值为0,1,这表示总线上所有设备在这一位上的值都是0
- 8. 总控写入一个bit, 因为值是确定的, 这次写入的是0
- 9. 总控再执行两次读操作,读到的值为0,0,这表示总线上还有多个设备,在这一位上的值不同
- 10. 总控写入一个bit, 这次写入**0**, 这将屏蔽 ROM1, 仅留下 ROM4
- 11. 总控重复进行三步操作, 读出 ROM4 剩余的位, 完成第一次搜索
- 12. 总控再次重复之前的搜索直到第7位
- 13. 总控写入一个bit, 这次写入1, 将屏蔽 ROM4, 仅保留 ROM1

- 14. 总控通过重复三步操作, 读出 ROM1 剩余的位
- 15. 总控再次重复之前的搜索直到第3位
- 16. 总控写入一个bit, 这次写入1, 将屏蔽 ROM1 和 ROM4 仅保留 ROM2 和 ROM3
- 17. 重复之前的逻辑, 当所有**00**读数都被处理, 说明设备的ROM已经全部被读取.

总控通过单线总线读取所有设备,每个设备需要的时间为 960 µs + (8 + 3 x 64) 61 µs = 13.16 ms ,识别速度为每秒钟75个设备.

代码逻辑

使用代码实现时,整体的逻辑是按一个固定的方向(先0后1)深度优先遍历一个二叉树.

数据结构

- 预设一个8字节数组 Buff 用于记录路径(即ROM的读数)
- 预设一个8字节数组 Stack, 用于记录每一位的值是否确定, 如果确定就是1, 未确定就是0.
- 预设一个整数变量 Split Point 用于记录每一轮搜索中得到的最深分叉点的位置,下一次到这一位就用1进行分叉。

遍历逻辑

在每一轮遍历中

- 1. 从低位开始, 每一位进行两次读, 得到这一位的值和补码
- 2. 对前面的结果进行判断
 - 1. 如果为11, 说明没有设备, 直接退出
 - 2. 如果为01, 说明这一位都是0, 写入 Buff, 同时将 Stack 这一位设成 1, 表示这一位已确认
 - 3. 如果为10, 说明这一位都是1, 写入 Buff, 同时将 Stack 这一位设成 1, 表示这一位已确认
 - 4. 如果为00, 说明这一位产生了分叉, 需要继续判断
- 3. 对分叉的判断, 与 Split Point 记录的值进行比较
 - 1. 如果当前位置比已知的分叉点更浅,说明还没到该分叉的位置,继续设置成 Buff 中上一次使用的值, Stack不变
 - 2. 如果当前位置等于分叉点, 说明已经到了上次定好的分叉位置, 上次已经用0分叉过了, 这次就用1进行分叉, 这一位就确认了, 将 Stack 这一位设成 1, 表示已确认
 - 3. 如果当前位置比已知的分叉点位置还要深,说明发现了新的分叉点(例如用1分叉后,进入了新的子树,发现下面还有分叉), 更新 Split_Point 记录分叉点位置,将 Stack 这一位设成 0 (未确认),用默认的0继续往下走
- 4. 在这轮遍历结束后, Buff 就得到了一个新的地址
- 5. 检查 Split_Point 是否需要往上挪: 在 Stack 上找到 Split_Point 标识的位置,如果值为1,则将 Split_Point 设置到最浅的一个0的位置. (例如这次正好在分叉点使用1分叉,当前点确认了,而之后又全是确认的情况,需要将分叉点往上移)
- 6. 结束条件: 和深度遍历一样, 每一轮遍历后分叉点可能会上下变化, 当分叉点的位置为0时, 说明遍历结束

代码实现

搜索逻辑的C语言代码实现

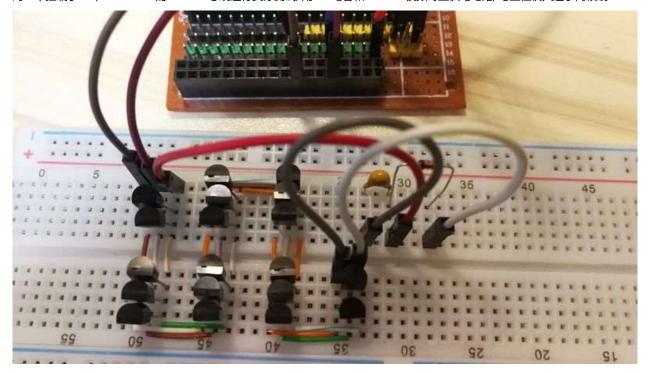
```
1 /**
2
   * buff, stack 和 split_point 都是全局变量, 由外部传入
3
4
5
  uint8_t DS18B20_Search(uint8_t *buff, uint8_t *stack, uint8_t split_point)
6
7
       uint8_t len = 64, pos = 0;
8
       /* 分叉点的初始值应该用0xFF, 如果输入参数为0, 将其设为0xFF */
9
       split_point = (split_point = 0x00)? 0xFF : split_point;
       /* Reset line */
10
11
       DS18B20_Reset();
12
       /* Start searching */
13
       DS18B20_WriteByte(ONEWIRE_CMD_SEARCHROM);
14
15
       // len 初始值为64, 对 8 字节 ROM 做一个遍历
       while (len--)
16
17
18
          // 两次读,读取这一位bit值和补码
19
          __BIT pb = DS18B20_ReadBit();
20
           __BIT cb = DS18B20_ReadBit();
21
          if (pb && cb) // 都是1, 表示没有设备
22
23
              return 0;
24
25
          else if (pb) // pb=1, cb=0, 说明这一位为1
26
          {
```

```
27
               // 在buff上记录这一位
28
               *(buff + pos / 8) \models 0x01 << (pos % 8);
29
               DS18B20_WriteBit(SET);
30
               // 在stack上将这一位记录为1, 表示已确认
               *(stack + pos / 8) \models 0x01 << (pos % 8);
32
           }
33
           else if (cb) // pb=0, cb=1, 说明这一位为0
34
           {
               // 在buff上记录这一位
35
36
               *(buff + pos / 8) &= \sim(0x01 << (pos % 8));
37
               DS18B20_WriteBit(RESET);
38
               // 在stack上将这一位记录为1,表示已确认
39
               *(stack + pos / 8) \models 0x01 << (pos % 8);
40
           }
           else // 出现分叉点
41
42
43
               if (split_point = 0xFF || pos > split_point)
44
45
                   // 比上次记录的点更深, 出现了新的分叉点
                   *(buff + pos / 8) \&= \sim(0x01 << (pos % 8));
46
47
                   DS18B20_WriteBit(RESET);
48
                   // 在stack上将这一位记录为0,表示未确认
49
                   *(stack + pos / 8) &= ~(0x01 << (pos % 8));
50
                   // 记录新的分叉点位置
51
                   split_point = pos;
52
               }
53
               else if (pos = split_point)
54
               {
                   // 到达了上次记录的分叉点位置, 这次使用1继续往下走
56
                   *(buff + pos / 8) \models 0x01 << (pos % 8);
57
                   DS18B20_WriteBit(SET);
58
                   // 在stack上将这一位记录为1,表示已确认
                   *(stack + pos / 8) \models 0x01 << (pos % 8);
59
               }
60
               else
61
62
               {
                   // 这个分叉点处于中间位置,还没到处理时间,继续使用上次记录的值
63
64
                   DS18B20_WriteBit(*(buff + pos / 8) >> (pos % 8) & 0x01);
65
               }
           }
66
67
           pos++;
68
69
       // 重新定位分叉点,将其指向到stack上最后一个未确认的位置
       while (split_point > 0 && *(stack + split_point / 8) >> (split_point % 8) & 0x01 =
   0x01) split_point--;
71
       return split_point;
72 }
```

调用方法

```
1 sp = 0;
2
   do
3
   {
4
       // ROM search and store ROM bytes to addr
5
       sp = DS18B20_Detect(addr, Search_Stack, sp);
        // Print the new split point and address
6
7
       UART1_TxHex(sp);
8
       UART1_TxChar(' ');
9
       PrintArray(addr, 0, 8);
10
       UART1_TxString("\r\n");
11 } while (sp);
```

对一个挂载了19个 DS18B20 的 1-Wire 总线进行实际测试, 用1uF电容和1N4148模拟寄生供电电路, 与上位机只连了两根线.



实际的测试输出如下,第一列输出的是Split_Point的值,表示当前的分叉深度,后半部分是这个DS18B20采样的温度值和CRC

```
OF 2854FD96F0013C1A......B20155057FA5A5669A CRC:9A CR LF
   OD 28D44496F0013C4C......BD0155057FA5A56660 CRC:60 CR LE
2
   OB 28744196F0013CC2......B50155057FA5A5664A CRC:4A CR LF
   09 280CCB96F0013C8D......B20155057FA5A5669A CRC:9A CR LF
   OB 28D2A396F0013C75......B50155057FA5A5664A CRC:4A CR LF
5
   OD 288AFB48F6973CFD.....BE0155057FA581665F CRC:5F CR LF
   OC 28AA8196F0013C37......B40155057FA5A56609 CRC:09 CR LF
7
   OA 283A9096F0013C37......B80155057FA5A56636 CRC:36 CR LF
8
   08 283E5996F0013C3A......B80155057FA5A56636 CRC:36 CR LF
9
10 OB 2811E896F0013C2A......B70155057FA5816636 CRC:36 CR LF
11 OC 28C90196F0013C66......B40155057FA5A56609 CRC:09 CR LF
12 OD 28597196F0013CBA......B80155057FA5A56636 CRC:36 CR LF
13 OA 28794648F65D3C26......B60155057FA5A5668F CRC:8F CR LF
15 OC 28ADCB96F0013CE6......BA0155057FA581664A CRC:4A CR LF
16 09 281D1648F64B3CEA......BD0155057FA5A56660 CRC:60 CR LF
17 OB 2843E896F0013C6A......BB0155057FA5A566F3 CRC:F3 CR LF
18 OA 289B0896F0013CD5......B70155057FA5816636 CRC:36 CR LF
19 00 28EF5C96F0013C1B......BE0155057FA5A566A5 CRC:A5 CR LF
```

参考

单线总线搜索算法 1-WIRE SEARCH ALGORITHM https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/app-notes/1/187.html